

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 6, 2009

Адсорбционные состояния протия и дейтерия в пересажженных полимерных углеводородных пленках из токамака T-10	
<i>Н. Ю. Свечников, В. Г. Станкевич, Л. П. Суханов, К. А. Меньшиков, А. М. Лебедев, Б. Н. Колбасов, Я. В. Зубавичус, Д. Раджаратнам</i>	5
Принципы обобщенной спин-эхоспектроскопии	
<i>В. Т. Лебедев</i>	14
Об искажениях формы линии брэгговских пиков в порошковом нейтронном дифрактометре	
<i>В. И. Бобровский</i>	22
Особенности рентгеновской дифракции на монокристаллах сапфира с наноструктурированной поверхностью	
<i>А. Е. Благов, П. А. Просеков, Ю. В. Грищенко, М. Л. Занадескин, Б. С. Роцин, А. В. Бутахин, В. А. Федоров, В. М. Каневский, В. Е. Асадчиков</i>	33
Исследование молекулярных комплексов сыворотки крови методами лазерной корреляционной спектроскопии и атомно-силовой микроскопии	
<i>М. В. Спиридонов, В. Г. Певгов, А. С. Батулин, Г. К. Григорьев</i>	37
Анализ элементного состава доброкачественных и злокачественных опухолей матки в сопоставлении с клиническими характеристиками	
<i>В. В. Бажанова, А. Д. Шапоренко, Л. Ф. Гуляева, С. Э. Красильников, В. Г. Сисакян, А. П. Кулиджанян</i>	44
Анализ тонкой структуры спектров рентгеновского поглощения за K-краем никеля в комплексе $Ni((C_2H_5O)_2PS_2)_2$	
<i>Г. Б. Сухарина, А. В. Солдатов, А. Н. Кравцова, Л. Н. Мазалов, С. В. Трубина, С. Б. Эренбург, Н. В. Бауск, Н. А. Крючкова</i>	49
Анализ локальной атомной структуры наночастиц нитрида алюминия	
<i>А. А. Гуда, В. Л. Мазалова, Г. Э. Яловега, А. В. Солдатов</i>	52
Локальная структура тонких пленок разбавленных магнитных полупроводников	
<i>Н. Ю. Смоленцев, S. Q. Wei, А. В. Солдатов</i>	56
Methods of Electron Microdiffraction and X-Ray Analysis in Structure Study of Nanodisperse Partially Stabilized ZrO_2 Powders	
<i>N. A. Zaporina, O. A. Doynikova, A. P. Krumina, D. A. Bocharov, J. P. Grabis</i>	60
Микроструктура и магнитные свойства аморфных пленок сплавов кобальт-фосфор, полученных в условиях импульсного электролиза	
<i>С. С. Грабчиков, О. И. Потужная</i>	64
Зависимость спектрально-угловой плотности параметрического рентгеновского излучения, направленного вдоль скорости релятивистского электрона, от угла между отражающими плоскостями и поверхностью	
<i>С. В. Блажевич, А. В. Носков</i>	71
Использование проекционного метода для определения статистических характеристик решения дифференциального уравнения диффузии неосновных носителей заряда, генерированных в полупроводниковом материале широким электронным пучком	
<i>Е. В. Серегина, А. М. Макаренков, М. А. Степович</i>	80
Ширина окон электронной прозрачности при структурно-геометрическом резонансе на планарной наноструктуре	
<i>Г. В. Вольф, Ю. П. Чубурин</i>	96

Рентгенографическое исследование покрытий, полученных вблизи катода
при ионно-плазменном осаждении нитрида титана

Н. А. Панькин, Н. А. Смоланов

102

Влияние градиента температуры на поляризацию в приповерхностном
слое кристаллов ТГС

О. В. Мальшикина

106
